

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/2

品名<Model Name> (メモリハイロガー<MEMORY HiLOGGER>)
形名<Model Number> (8430)
製造番号<Serial No.> (No. 190812345)
検査年月日<Test Date> (2019-08-26)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	結果 <Result>
1. セルフチェック<Self Check>	
-1.ROM, RAMチェック<ROM, RAM Check>	(PASS)
-2.キーチェック、LED チェック<Keyboard Check, LED Check>	(PASS)
-3.LCDチェック<LCD Check>	(PASS)
-4.バックライトチェック<Back Light Check>	(PASS)
-5.バックライトの明るさ<Brightness of the Back Light>	(PASS)
2. 機能<Function>	
-1.データストレージ、圧縮機能<Data Storage, Compression>	(PASS)
-2.TRIG OUT端子<TRIG OUT>	(PASS)
-3.EXT TRIG端子<EXT TRIG>	(PASS)
-4.時計のバックアップ<Backup of the Clock>	(PASS)
-5.波形のバックアップ<Backup of the Wave>	(PASS)
-6.電源表示チェック<Power Supply Indication Check>	(PASS)
-7.充電動作のチェック<Battery Charge>	(PASS)
-8.CFスロット、USBコネクタ<CF Slot, USB Connector>	(PASS)
3. 断線検出<Burn Out>	(PASS)
4. パルス入力<Pulse>	(PASS)
5. 時間軸精度<Time Base>	(PASS)
6. スキャン動作チェック<Scan Operation Check>	(PASS)

備考<Note>

下記製品は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名を8430と表記しています。
8430, 8430-20, 8430-21

<Because the inspection points of Models 8430, 8430-20 and 8430-21 are the same,
"Model 8430" is used in this data sheet to represent all three models.>

8430は1つの計測回路で測定しているため、ch1で代表して校正しています。

<Because Model 8430 uses one measurement circuit to conduct measurements,
ch1 is used as the reference channel during calibration.>

ch2～10については、スキャン動作チェックにより、切替動作が正常であることを確認しています。

<The switching operation of ch2 to ch10 are confirmed by checking the Scan Operation Check.>

*1.FAIL判定箇所は、グレー表示としています。

<FAIL decision points are highlighted in gray.>

*2.標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

No.8430-7

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

2/2

品名<Model Name> (メモリハイロガー<MEMORY HiLOGGER>)
 形名<Model Number> (8430)
 製造番号<Serial No.> (No. 190812345)
 検査年月日<Test Date> (2019-08-26)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

<Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	*2 許容範囲 <Tolerance>	*1 測定値 <Measured Value>
7. 電圧測定精度<Volt>				
100 mV		100 mV	99.900 mV ~ 100.100 mV	(99.980 mV)
		0 mV	-0.100 mV ~ 0.100 mV	(0.000 mV)
1 V		-100 mV	-100.100 mV ~ -99.900 mV	(-99.980 mV)
		1 V	0.99900 V ~ 1.00100 V	(0.99990 V)
		0 V	-0.00100 V ~ 0.00100 V	(0.00005 V)
		-1 V	-1.00100 V ~ -0.99900 V	(-0.99985 V)
10 V		10 V	9.9900 V ~ 10.0100 V	(9.9995 V)
		0 V	-0.0100 V ~ 0.0100 V	(0.0015 V)
		-10 V	-10.0100 V ~ -9.9900 V	(-9.9970 V)
20 V		20 V	19.9800 V ~ 20.0200 V	(19.9980 V)
		0 V	-0.0200 V ~ 0.0200 V	(0.0010 V)
		-20 V	-20.0200 V ~ -19.9800 V	(-19.9950 V)
100 V		60 V	59.900 V ~ 60.100 V	(59.985 V)
		0 V	-0.100 V ~ 0.100 V	(0.000 V)
		-60 V	-60.100 V ~ -59.900 V	(-59.990 V)
8. 熱電対測定精度<TC> (基準接点補償なし)				
熱電対	N	-200 °C	-202.0 °C ~ -198.0 °C	(-200.0 °C)
	B	400 °C	397.0 °C ~ 403.0 °C	(400.3 °C)
	K	1300 °C	1298.0 °C ~ 1302.0 °C	(1300.2 °C)
	R	1700 °C	1697.0 °C ~ 1703.0 °C	(1700.1 °C)
9. 熱電対測定精度<TC・RJC> (基準接点補償あり)				
(標準器校正値) (<Std. Cal. Value>)				
熱電対	K	0°C	(0.1 °C)	-2.9 °C ~ 3.1 °C (-0.1 °C)
		1300°C	(1300.5 °C)	1297.5 °C ~ 1303.5 °C (1300.0 °C)